

## 両面顕微鏡システム

### NEW 両面顕微鏡 位置ずれ計測システム TOMOS-50

両面顕微鏡を使った、両面パターンの位置関係、位置ずれ、微小寸法を計測するシステムです。

- ◎ 小型化高精度化し、両面の位置ずれを±0.3umで測定
- ◎ 上下の光軸ずれ、レンズ倍率のばらつき、カメラの角度を画像補正
- ◎ FA自動化へ対応可能なシステム、オプションでAFを追加可能



【表裏寸法・位置ずれ計測】



【用途】

水晶振動子、MEMS、半導体、インクジェットノズル穴、メッシュフィルター等の両面寸法、位置ズレ計測

### 両面顕微鏡 計測システム TM-100

両面顕微鏡を使った、両面パターンの位置ずれ、微小寸法測定の外に高さ、段差、更に厚みまで、これ1台で測定可能な画期的システムです。

- ◎ 射影パターン照明により、材料や電子部品の段差、厚みを非接触で個人誤差が少なく、簡単に測定できます。
- ◎ 1台の顕微鏡で表面、裏面を同時に観察・計測できます。
- ◎ 自動で両面カメラの光軸、倍率を補正し、高精度に測定可能。



【段差・厚み計測】

【表裏寸法・位置ずれ計測】



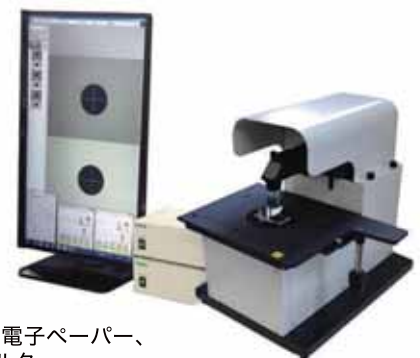
【用途】

水晶振動子、フィルム、プリント基板等の厚み、段差、寸法、位置ずれ計測

### NEW 両面顕微鏡 AF付き位置ずれ計測システム TM-200

両面顕微鏡を使った、両面パターンの位置関係、位置ずれ、微小寸法を計測するシステムです。

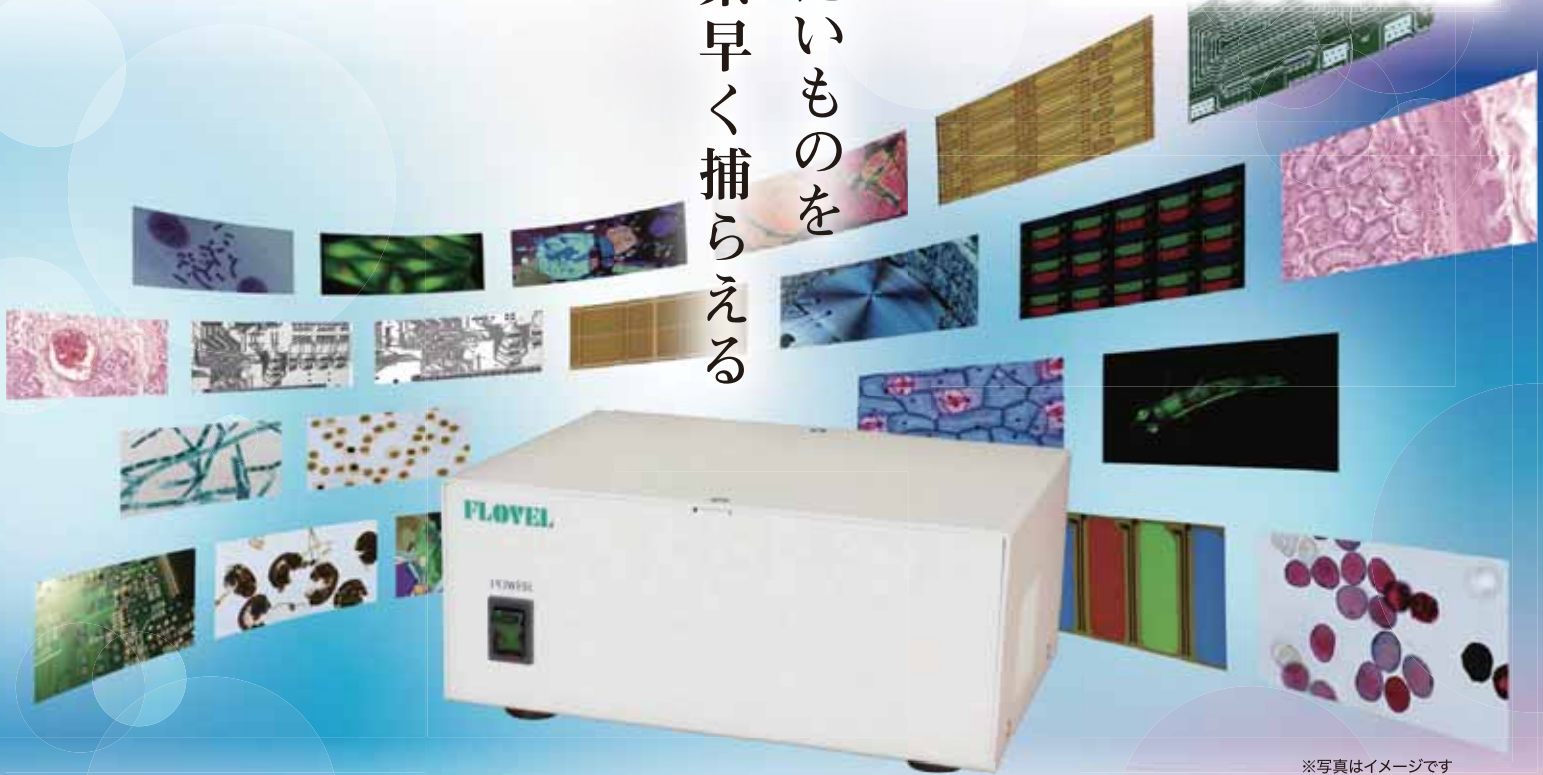
- ◎ 小型化高精度化し、両面の位置ずれを±0.5umで測定
- ◎ FA自動化へ対応可能なシステム
- ◎ 両面にAFを搭載し、再現性の高い計測が可能
- ◎ 下側にIRカメラも搭載可能で、内部の位置ズレも計測可能



【用途】

水晶振動子、電子ペーパー、メッシュフィルター、プリント基板貫通穴等の両面位置ズレ計測

見たいものを  
素早く捕らえる



※写真はイメージです

オートフォーカスユニット(カメラ付)

# Mimic-AF300 (3M版) / Mimic-AF500 (5M版)

付属カメラ

- 300万画素 1/1.8型CMOS 約60fps
- 500万画素 2/3型CMOS 約35fps

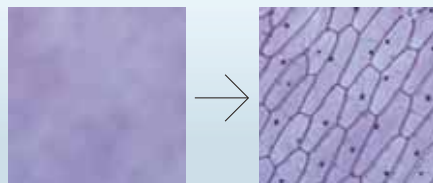


- ◎ 従来製品の約2倍高速にフォーカスを合わせます
- ◎ お手持ちの撮影環境に後付け可能な単体ユニットタイプ
- ◎ 様々な環境でオートフォーカスを使用可能

製品特長

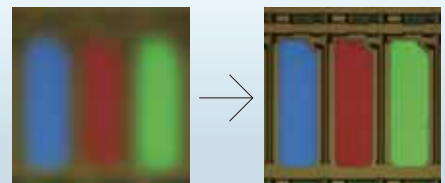
- オートフォーカスを高速・高精度で実現し、円滑なフォーカス作業を支援
- 画像コントラスト方式の採用で様々な顕微鏡に後付け可能な汎用性の高い環境を実現
- 1ステップでオートフォーカスを実行できる簡単操作
- ユーザーの好みに合わせカスタマイズできる豊富なカスタムモード
- オートフォーカス動作時の安全性を高めるソフト・ハードウェアリミット機能を搭載

細胞を映したイメージ



オートフォーカスイメージ

パターン回路イメージ



**!** 安全に関するご注意 ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。

**FLOVEL**<sup>®</sup> 株式会社 フロベール

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-1-7 タマビル恵比寿3階  
TEL:03-5475-5180 FAX:03-5475-5181  
E-mail:sales@flovel.co.jp

www.flovel.co.jp

お問い合わせ・ご注文